文章编号: 1007-4627(2018)03-0327-08

Re³⁰⁺离子双电子复合速率系数的理论研究

田瑞^{1,2},符彦飙^{1,2,†},魏二龙^{1,2},董晨钟^{1,2}

(1. 西北师范大学物理与电子工程学院,兰州 730070;2. 甘肃省原子分子物理与功能材料材料重点实验室,兰州 730070)

摘要: 复杂结构离子的双电子复合速率系数在极紫外光刻光源、核聚变等应用研究的等离子体光谱模拟和诊断中具有重要的应用价值。利用全相对论组态相互作用方法,详细计算了基组态为4p⁶4d⁹的Re³⁰⁺离子经 双激发态(4p⁶4d⁹)⁻¹nln'l'(n=4~6, n'=4~23)的双电子复合(DR)过程。研究分析了激发、辐射通道,组 态相互作用,级联退激对DR速率系数的影响。其中内壳层4p电子激发的DR速率系数是总DR速率系数 的28.2%~44.9%,所以内壳层4p电子激发的贡献不可以忽略。级联退激对DR速率系数的最大贡献为12.9%, 也必须要予以考虑。通过对双电子复合、辐射复合、以及三体复合速率系数的比较,辐射复合速率系数的最 大值为DR速率系数的22.6%,三体复合速率系数的最大值仅为DR速率系数的0.3%。因此,DR速率系数远远大于辐射复合和三体复合速率系数。该结果表明DR过程对于等离子体离化态分布、能级布居以及光谱模 拟都极为重要。为了方便应用,对基态和第一激发态的总DR速率系数进行了参数拟合。该研究结果将为Re 激光等离子体的光谱模拟及复杂结构离子DR过程的进一步研究提供参考。

关键词:双电子复合;DR速率系数;DAC效应

中图分类号: O562.4 文献标志码: A DOI: 10.11804/NuclPhysRev.35.03.327

1 引言

双电子复合(DR)过程,是实验室高温等离子体和 天体等离子体中对建立等离子体电离平衡和能级布居 起着重要作用的一种原子动力学过程。近年来,基于 极紫外(EUV)光刻光源研究背景, 人们对于等离子体 的激光诱导发射光谱特性进行了诸多的研究。2003年, Gilleron 等^[1]研究了激光产生的 Xe 等离子体 EUV 发射 光谱特性,对涉及到的有关跃迁进行了详细的计算。 2007年, Shen等^[2]利用组态相互作用和扭曲波近似方 法系统计算了 Xe¹⁰⁺ 离子的能级、振子强度、辐射跃迁 几率以及电子碰撞激发强度,模拟了 Xe¹⁰⁺ 离子 EUV 波段的发射谱。2012年, Zhang等^[3]利用相对论多组 态原子程序软件包 FAC^[4]计算了 Xe⁸⁺ 离子 DR 速率系 数。2005年,Liang等^[5]利用FAC程序计算模拟了O⁴⁺ 离子的X射线及EUV光谱。这些中高Z元素高离化 态多电子离子的EUV 光谱的相关研究,不仅有助于 与之相关的EUV 光刻光源和实验室等离子体的诊断、 模拟等的研究工作,而且在核聚变、天体等离子体、 水窗源、原子光谱学等的研究范围也有诸多的重要应 用[6-9]。

对于 Re 等离子体,国内外研究组观测到其个别离 化态的EUV 光谱,并进行了简单的理论计算,但对 Re离子的DR过程还没有进行详细的研究。1983年, Mandelbaum^[10]等利用激光诱导等离子体技术在0.6~ 0.9 nm的波段范围内,观测并且分析了激光产生的高 离化态Re等离子体在此波段内发生的3d-4p跃迁的 光谱。1996年, Kildiyarova 等^[11]研究了 Re^{4+} 的 (5d³+ 5d²6s)-5d²6p 跃迁。2015年,Wu等^[12]在不同的激光 功率密度条件下,利用两种 Nd:YAG 激光器产生的 150 ps, 10 ns 脉冲激光, 在 1~7 nm 波段内观测到了由复杂 结构的 Re¹⁴⁺ ~ Re³⁸⁺ 离子分布引起的 ps 光谱和 ns 光 谱发射特性的差异。为了更好地模拟 Re 等离子体的光 谱,对模拟所需的参数进行理论计算是十分重要的。对 于基组态为4dⁿ的复杂结构重离子的EUV光谱,由于 其相关跃迁涉及到多个4l壳层电子,电子的强烈耦合 可以形成非常复杂的近简并能级,这些能级之间的跃 迁形成的谱线将变得非常复杂,并且相互重叠,形成所 谓的"不可分辨的跃迁峰(UTA)"。这就使得对这些谱 线的分析和辨认变得非常困难。因此,必须对有关离子 态的能级结构和跃迁光谱特性进行详细的理论和实验 方面的分析研究。在中等电子密度情况下,有不少原子

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (11464043)

收稿日期: 2018-04-28; 修改日期: 2018-05-25

作者简介:田瑞(1993-),女,甘肃定西人,硕士研究生,从事原子结构和原子碰撞研究;

[†]通信作者:符彦飙, E-mail: fuyb@nwnu.edu.cn。

原子核物理评论

分布在激发态上,对于这些原子数密度分布,不仅要计 算不同电离度原子的丰度,还要计算所有重要激发态 的占据率,这就必须求解包含各种电离与复合、激发 与退激发过程的速率方程。而对于基组态为4dⁿ的复杂 结构离子的DR速率系数,在以往的光谱模拟中由于没 有合适的经验公式以及计算的艰难,从来没有被考虑 过。实际上,在很多情况下其DR速率系数大于辐射复 合 (RR)、以及三体复合 (TBR) 速率系数^[13-16]。因而, 相关的DR 过程参数的精确计算是非常重要的。另外, 国内外研究组对于基组态为4dn 结构复杂离子DR 过程 的计算,往往只考虑中间双激发态的共振稳态跃迁(RS) 和非共振稳态跃迁(NRS)^[17],忽略中间双激发态辐射 跃迁至自电离态且随后级联退激(DAC)对DR过程的 影响。Fu 等^[14] 对基组态为 $4s^2 4p^6 4d^9$ 结构的 Au³⁴⁺ 离 子的DR 过程的理论研究结果展示 DAC 效应对总 DR 速率系数的最大贡献为12%, DAC效应比较重要。目 前国际上对基组态为4dⁿ的Re离子内外壳层电子激发 的DR 过程的研究还未见报道。Wu 等^[12]所做的激光 等离子体 Re¹⁴⁺~Re³⁸⁺离子 EUV 光谱识别和分析中, 也未考虑 DR 过程的贡献。因此,细致计算分析基组态 为 $4d^n$ 的Re离子的包括内壳层电子激发以及DAC效应 的 DR 过程,对于 Re 离子的激光等离子体光谱模拟和 光谱识别,以及复杂结构重离子 DR 过程的研究都具有 价值和意义。

本文利用基于相对论组态相互作用方法的FAC程 序包,细致研究Re³⁰⁺离子的激发、辐射通道,组态相 互作用,DAC效应对DR速率系数的影响。利用经验 公式计算了RR、TBR的速率系数,并与总DR速率系 数进行比较。为方便应用,对基态和第一激发态的DR 速率系数进行了参数拟合。

2 理论方法

Re³⁰⁺离子由基态*i*俘获一个自由电子,形成中间 双激发态*j*,再辐射退激发到*f*的双电子复合过程为

$$\operatorname{Re}^{30+}(4s^{2}4p^{6}4d^{9}) + e^{-} \rightarrow$$

$$\operatorname{Re}^{29+}[(4s^{2}4p^{6}4d^{9})^{-1}n\ln'l']^{**} \rightarrow$$

$$\operatorname{Re}^{29+}[(4s^{2}4p^{6}4d^{9})^{-1}n'l''n'l' +$$

$$(4s^{2}4p^{6}4d^{9})^{-1}n\ln'''l''']^{*} + h\nu, \qquad (1)$$

其中: **表示中间双激发态 *j*; *表示辐射跃迁末态 *f*; *n*表示主量子数; *l*表示电子轨道角动量子数。

在热等离子体中,自由电子的速率分布遵循 Maxwell-Boltzmann分布,则由初态*i*经过双激发态*j* 再到所有辐射跃迁末态*f*的DR速率系数可以表示为

$$\alpha_{ij}^{\mathrm{DR}}(kT_{\mathrm{e}}) = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{m_{\mathrm{e}}kT_{\mathrm{e}}}\right)^{3/2} \frac{g_j}{2g_i} A_{ji}^a B_j \exp\left(-\frac{E_{ji}}{kT_{\mathrm{e}}}\right) ,$$
(2)

这里: T_e 是电子温度; k 是波尔兹曼常数; E_{ji} 是共振 能量; m_e 是电子质量; $g_i \ \pi g_j \ \beta$ 别是初态 i 和中间双 激发态 j 的统计权重; A_{ji}^a 是由态 j 到 i 的自电离速率; B_j 是分支比; 其表达式为

$$B_{j} = \frac{\sum_{f} A_{jf}^{r} B_{f}}{\sum_{f} A_{jf}^{r} + \sum_{i'} A_{ji'}^{a}} , \qquad (3)$$

其中: A_{ji}^{a} 是双激发态 j 到俄歇末态 i' 的俄歇速率; A_{jf}^{r} 是双激发态 j 到末态 f 的辐射速率; B_{f} 是末态 f 的分 支比。本文的计算中, n' < 24 的 DR 速率系数通过从头 计算得到, $n' = 24 \sim 1000$ 的 DR 速率系数通过 n'^{-3} 标 度率外推得到, 外推公式^[14] 为

$$\alpha^{\mathrm{DR}}(n') = \sum_{j} \left(\frac{n'}{n_{s}}\right)^{-3} \alpha_{j}^{\mathrm{DR}}(n_{s}) \cdot \frac{\sum_{j} A_{jf'}^{\mathrm{low}} + \sum_{f} A_{jf}^{\mathrm{high}} + \sum_{i'} A_{ji'}^{a}}{\sum_{f'} A_{jf'}^{\mathrm{low}} B_{f'} + \sum_{f} A_{jf}^{\mathrm{high}} B_{f}} \cdot \frac{\sum_{f'} A_{jf'}^{\mathrm{low}} B_{f'} + \left(\frac{n'}{n_{s}}\right)^{-3} \sum_{f} A_{jf}^{\mathrm{high}} B_{f}}{\sum_{f'} A_{jf'}^{\mathrm{low}} + \left(\frac{n'}{n_{s}}\right)^{-3} \sum_{f} A_{jf}^{\mathrm{high}} + \left(\frac{n'}{n_{s}}\right)^{-3} \sum_{i'} A_{ji'}^{a}},$$
(4)

其中: $A_{jf'}^{\text{low}} n A_{jf}^{\text{high}}$ 分别是能级 j 的内壳层电子和外壳 层里德堡电子 n_s 的辐射跃迁速率。

辐射复合和三体复合过程作为另外两种重要的电子-离子非弹性碰撞现象,其速率系数分别由如下的经验公式简单估算得到^[18]

$$\alpha^{\text{RR}} = 5.2 \times 10^{-14} \left(V_{\text{ion}} / T_{\text{e}} \right)^{\frac{1}{2}} Z [0.429 + 0.5 \ln(V_{\text{ion}} / T_{\text{e}}) + 0.469 (T_{\text{e}} / V_{\text{ion}})^{\frac{1}{2}}], \quad (5)$$

$$n_{\rm e}\alpha^{\rm TBR} = 2.97 \times 10^{-27} n_{\rm e} n_z / \left[T_{\rm e} V_{\rm ion}^2 \left(4.88 + T_{\rm e} / V_{\rm ion} \right) \right],$$
(6)

其中: V_{ion} 是电离势;Z是电荷态; n_z 是对应离化态离子的最外层电子数; n_e 是电子密度。在本文的计算中取 值 10^{21} cm⁻³。

3 结果与讨论

基组态为4d⁹离子的DR过程能级众多,跃迁复杂, 尤其在考虑DAC效应的精细计算时需要耗费大量的资 源。为在有限的资源下忽略不重要的贡献,首先以基态 作为初态,详细分析各种效应及通道对 Re³⁰⁺离子 DR 过程的贡献。

3.1 Re²⁹⁺ 离子辐射跃迁波长比较

表1展示了对Re²⁹⁺离子的4 d^94f -4 d^{10} ,4 d^95p -4 d^{10} ,4 d^95f -4 d^{10} 跃迁波长所做的比较。其中,上标 COWAN-Wu为Wu等^[12]用COWAN程序包计算的理 论结果。从表中可以看到,和COWAN计算的波长结果 比较,利用FAC计算得到的结果最大偏差为1.19%,最 小为0.13%。和COWAN-Wu的计算比较,利用FAC 计算得到的结果最大偏差为2.81%,最小为0.41%。 与COWAN-Wu的计算相比,我们利用COWAN计算 得到的结果最大偏差为2.60%,最小为0.005%。因为最 终进行的是DR总速率系数的计算,所以我们用FAC 和COWAN计算的结果同Wu等^[12]用COWAN计算的 结果符合得比较好。

表 1 Re^{29+} 离 子 $4d^94f$ - $4d^{10}$ 、 $4d^95p$ - $4d^{10}$ 、 $4d^95f$ - $4d^{10}$ 跃迁波长 nm

N	o. Transition	$\lambda^{ m FAC}$	$\lambda^{\rm COWAN}$	$\lambda^{ ext{COWAN-Wu}}$	
1	$4d^{101}S_0-4d^95p^3P_1$	2.8384	2.8347	2.8263	
2	$4d^{101}S_0-4d^95p^1P_1$	2.7570	2.7364	2.742.7	•
3	$4d^{101}S_0-4d^95p^3D_1$	2.6561	2.6358	2.6436	
4	$4d^{101}S_0-4d^94f^3P_1$	6.2963	6.2384	6.2440	
5	$4d^{101}S_0-4d^94f^3D_1$	5.8308	5.8002	5.8013	
6	$4d^{101}S_0-4d^94f^1P_1$	4.6929	4.7486	4.7483	
7	$4d^{101}S_0-4d^95f^3P_1$	2.0226	2.0145	2.0144	
8	$4d^{101}S_0-4d^95f^3D_1$	2.0090	2.0015	1.9525	
9	$4d^{101}S_0-4d^95f^1P_1$	1.9585	1.9509	2.0017	

3.2 激发和辐射通道

图1展示了中间双激发态为 $j = (4s^24p^64d^9)^{-1}$ 4l10f的DR速率系数。由图可见,4d电子激发的DR 速率系数最大,4p次之,4s的DR速率系数最小。考 察曲线峰值附近,4p电子激发的DR速率系数是4d的6.4%,其对总DR速率系数的贡献不可以忽略。4s电子激发的DR速率系数是4d的0.6%,在本文接下来 对DR速率系数各类效应的分析讨论以及总DR速率系 数的计算中,忽略4s电子激发的贡献。



图 1 (在线彩图) 4s, 4p, 4d 电子激发对 DR 速率系数 的贡献($j = (4s^24p^64d^9)^{-1}4l10f$)

图 2 展示了 $j = (4p^64d^9)^{-1}nl10l', n = 4, 5, 6$ 的 DR 速率系数。图 2(a) 为 4d 电子激发的 DR 速率系 数。由图可见, n = 4的 DR 速率系数最大, n = 6的最 小。n = 5的 DR 速率系数峰值为 n = 4的 7.5%, 而 n =



图 2 (在线彩图) $j = (4p^64d^9)^{-1}nl10l', n = 4$, 5, 6的 DR 速率系数 (a) 为 4d 电子激发的 DR 速率系数; (b) 为 4p 电子激发的 DR 速率系数。

6 的 DR 速率系数峰值仅为n = 4 的峰值的2.7%。 图 2(b) 为 4p 电子激发的 DR 速率系数。其中,n = 5 的 DR 速率系数峰值为n = 4 的 66.6%,n = 6 的 DR 速率系数峰值为n = 5 的 26.4%,n = 6 的 DR 速率系数峰值仅为n = 4 的峰值的17.6%。4p电子激发的n = 5,6 的贡献相对比较大的原因是,中间双激发态 $4p^54d^{10}10l'$ 的4d 为满壳层,高壳层电子无法向4d 跃迁,比如10f 无法向4d 跃迁。而4p电子激发至n = 5,6 的中间双激发态 $4p^54d^9nl10l'$ 的高壳层电子既有向4p的跃迁,也有向4d的跃迁(比如10f向4d跃迁),导致 $4p^54d^{10}10l'$ 的贡献降低。4d和4p电子激发的 DR 速率系数的峰值相差一个数量级,相应的4 $p^54d^{10}6l10l'$ 对($4p^64d^9$)⁻¹nl10l'总DR 速率系数的贡献应该在1.7%以下。在 $j = (4p^64d^9)^{-1}nln'l'$ 的DR 速率系数的计算中,忽略n > 6的贡献。

图 3 展示了 $j = 4d^84f10f$,辐射跃迁末态 $f = 4d^910f$, $4d^94f$, $4d^84f5l''$, $4d^84f6l''$, $4d^84f7l''$, $4d^84f8l''$ 的 DR速率系数。曲线4为辐射跃迁至4l 壳层的 DR速率系数。曲线4 和5两者之间在峰值处 有 30.7%的差异。曲线6为辐射跃迁至4l~6l的 DR速 率系数,和曲线5有6.6%的差异。曲线7为辐射跃迁 至4l~7l的 DR速率系数,和曲线6有2.9%的差异。 曲线8为辐射跃迁至4l~8l的 DR速率系数,由图可 见,曲线8大致与曲线7重合。考虑到高壳层电子的辐 射跃迁以 n^{-3} 标度率递减,我们在计算中忽略辐射跃迁 至7l以上壳层的贡献。

3.3 组态相互作用的影响

图 4 展示了 $j = 4d^8 4f 10l'$ 考虑 CI 和不考虑 CI(NCI



图 3 (在线彩图) 辐射跃迁至不同壳层的DR 速率系数(j=4d⁸4f10f) 曲线4为辐射跃迁至4l壳层的DR速率系数,曲线5为辐射跃迁至4l,5l壳层的DR速率系数,曲线6为辐射跃迁 至4l-6l的DR速率系数,曲线7为辐射跃迁至4l-7l的DR 速率系数,曲线8为辐射跃迁至4l-8l的DR速率系数。

表示)的DR速率系数。对于初态,中间双激发态,辐 射跃迁末态,统一考虑 $4p^{-1}4f^{+1}$ 作为CI组态。由4(b) 图可以看到,对于l' = g, l' = h, CI效应使DR速率 系数略微减小。对于l' = i, l' = k, CI效应使其DR速 率系数略微增大。减小和增大作用最终相互抵消,因 此导致CI效应对求和后的DR速率系数几乎没有影响, 如图 4(a)所示。这种相互抵消对于其它的中间双激发 态也是类似的结果,所以我们在总DR速率系数的计算 中不考虑CI效应。但是在温度小于10 eV的低温区域, DR速率系数对于共振能比较敏感,而FAC程序在10 eV以下区域的共振能计算值不够准确,因此会带来DR 速率系数的计算偏差。



图 4 (在线彩图) CI 效应对 DR 速率系数的影响 $(j = 4d^84f10l')$ CI 表示考虑了 CI 效应的 DR 速率系数, NCI 表示没有考虑 CI 效应的 DR 速率系数。

3.4 级联退激的影响

图 5 展示了三种辐射跃迁末态的 DR 速率系数。辐射跃迁根据图 3 的分析,只考虑跃迁至 $4l \sim 7l$ 壳层的贡献。在图 5 中,RS+NRS 表示中间双激发态的辐射跃迁考虑了共振稳态跃迁 (RS) 和非共振稳态跃迁 (NRS); DAC 表示在 NRS + RS 的基础上,考虑了辐射跃迁 至可自电离态及其随后的级联退激;NDAC 表示考虑 和 DAC 相同的第一步辐射跃迁,但不考虑随后的级联 退激。在图 5(a)中, $j = 4d^84f10f$ 。由图可见,这三种 类型的辐射跃迁的 DR 速率系数几乎相等。原因是其辐 射末态大部分都处于电离限以下。图 6 展示了 4d,4p 电 子激发的电离限附近的能级,可以看到 $j = 4d^84f6l$ 的 能级都在电离限以下,相应的辐射跃迁到这些能级的只 有RS + NRS跃迁。图5(b)中 $j = 4d^85l10f$,280 eV温 度处曲线DAC的DR速率系数是RS + NRS的2.1倍, 并且随着温度的增加,DAC的贡献逐渐增大,在50000 eV处是2.6倍。由图6的能级图可以看到 $4d^85d6l$ 的能 级都处于电离限以上,相应的辐射跃迁到这些能级 上的级联退激对DR速率系数都有影响。280 eV处曲 线NDAC的DR速率系数是DAC的1.7倍,说明中间 双激发态的第一步辐射跃迁末态的Auger几率比较大, 所以计算中需要考虑第一步辐射跃迁末态分支比的影 响。由图6可以看到4p电子激发的双激发态有更多态 处于电离限以上,其DAC效应的影响会更大一些。



图 5 (在线彩图) 三种辐射跃迁末态的 DR 速率系数 图 (a) $j = 4d^84f10f$,图 (b) $j = 4d^85l10f$ 。RS + NRS表示中间双激发态的辐射跃迁考虑了 RS 和 NRS。DAC 表示在考虑 NRS + RS 的基础上,进一步考虑了 DAC。NDAC 表示考虑和 DAC 相同的第一步辐射跃迁,但不考虑随后的级联退激。



图 6 (在线彩图) Re³⁰⁺ 离子 4*d*, 4*p* 电子激发接近电离 限附近的能级 *E*_I 为电离限, *E*₀ 为基态能量

3.5 总 DR 速率系数

图7展示了Re³⁰⁺离子DR, RR, TBR速率 系数。曲线DR-DAC-4*d*, DR-DAC-4*p*, DR-DAC, DR-RS+NRS以及DR-NDAC为中间双激发态*j* = $(4p^{6}4d^{9})^{-1}nln'l'(n=4~6, n'=4~23)$ 时利用FAC 程序从头计算得到。DR-DAC-4*d*, DR-DAC-4*p*分别 为4*d*和4*p*电子激发的考虑了DAC效应的DR速率系 数。由图可见,在全温度范围内,4*d*电子激发的贡献 大于4*p*电子激发,4*p*电子激发的DR速率系数是4*d*电 子激发的DR速率系数的47%~81.5%,是总DR速率 系数的28.2%~44.9%。所以,内壳层4*p*电子激发的贡 献不可以忽略。此贡献远大于Au³⁴⁺离子的4*p*电子激 发的贡献^[14],原因在于Re³⁰⁺离子4*p*电子激发的DR 过程,有更多的双激发态处于电离限之上。由曲线DR-



图 7 (在线彩图) Re³⁰⁺ 离子 DR, RR, TBR 速率系数 E_1 为电离限, E_0 为基态能量曲线 DR-DAC-4d, DR-DAC-4p, DR-DAC, DR-RS+NRS 以及 DR-NDAC 为 $j = (4p^64d^9)^{-1}nln'l'(n = 4 ~ 6, n'=4 ~ 23)$ 的DR 速率系数,利用 FAC 程序从头计算得到。其中曲线 DR-DAC-4d 和 DR-DAC-4p 分别为4d 和 4p 电子激发的考 虑了 DAC 效应的 DR 速率系数,曲线 DR-DAC, DR-RS+NRS和 DR-NDAC 分别表示三种辐射跃迁末态类型 的 DR 速率系数,曲线 DR-DAC(n' = 24 ~ 1000) 为通 过 n' = 23 的数据按照式(4) 外推得到的 n' = 24 ~ 1000 的 DR 速率系数。

DAC和DR-RS+NRS的比较显示, 在温度 $kT_{\rm e} < 20 \, {\rm eV}$ 区域, DAC效应对DR速率系数没有影响, 在40 eV 处 DAC 增大了 DR 速率系数 0.74%。在 90 eV 处增大 了 0.8%, 在 30~100 eV 温度范围内, DAC 效应对 DR 速率系数的增大保持在1%以内。之后随着温度的增高, 影响逐渐增大。在280 eV处增大了DR速率系数4.6%, 在1000 eV处增大9%,在50000 eV处增大12.9%。由 图6中展示的电离限附近的能级图,和参考文献[14]中 相应的能级图比较, Re²⁹⁺离子相对于Au³³⁺离子 有更多的双激发态处于电离限之上,所以Re³⁰⁺离 子DAC的贡献要大于Au³⁴⁺离子。如果只考虑高里德 堡电子辐射跃迁而不考虑级联退激(曲线DR-NDAC), 在温度 $kT_{\rm e} < 20$ eV区域,NDAC对DR速率系数没 有影响,在40 eV处对DR速率系数(曲线DR-DAC) 有0.5%的增大,在90 eV处有1.6%的增大。并且随 着温度的增高,影响逐渐增大,在1000 eV处增大 到21.3%,在50000 eV处增大到25.3%。综合以上分 析,说明在级联退激中,Auger退激的速率比较大。曲 线 DR-DAC(n' = 24~1000) 为利用 n' = 23 的数据按 照式(4)外推得到的 $n' = 24 \sim 1000$ 的DR速率系数。

DR-DAC-total(n' = 4~1000)为总DR速率系数。外 推部分在90 eV处对于总DR速率系数的贡献为7.2%, 在50000 eV处为19.5%。而总DR速率系数在全温度 范围都大于 RR和TBR速率系数。由于DR速率系数 在高温处按照指数函数快速衰减,相应的RR和TBR 速率系数会随着温度的增高而贡献增大。其中 RR速率 系数的最大值为DR速率系数的22.6%,TBR速率系数 的最大值为DR速率系数的0.3%。可见DR过程对于等 离子体离化态分布和能级布居以及光谱模拟极为重要。 另外,由于TBR速率系数的大小是随着等离子体电子 密度的增加而增加的[见式(6)],在选取更大的电子密 度值时,TBR速率系数的值会增大。

为方便应用,分别对基态和第一激发态作为初态的 总 DR 速率系数进行了参数拟合,拟合公式为

$$\alpha^{\rm DR}(\kappa T_{\rm e}) = (\kappa T_{\rm e})^{-3/2} \sum_{i=1}^{6} c_i {\rm e}^{-E_i/\kappa T_{\rm e}} , \qquad (7)$$

其中: c_i (单位: cm³/s)和 E_i 是拟合参数; kT_e 是电子 温度。对于基态作为初态的DR速率系数拟合结果, 在温度为420 eV处,拟合偏差为1.3%,1500 eV处 为1.72%,其他数据点处的拟合偏差都小于1.0%。对于 第一激发态作为初态的DR速率系数拟合结果,在温度 为420 eV处,拟合偏差为1.13%,1000 eV处为1.08%, 在温度为1500 eV处,拟合偏差为1.63%,在温度 为2300 eV处,拟合偏差为2.38%,在温度为4000 eV 处,拟合偏差为1.08%,其他数据点处的拟合偏差都小 于1.0%。

表 2 Re^{30+} 离子 DR 速率系数参数拟合

			$\mathbf{M}[$	N] 代表 $M \times 10^4$
i	C_{i0}	E_{i0}	C_{i1}	E_{i1}
1	8.486[-6]	520.831	4.156[-4]	21.221
2	1.962[-7]	6.164	4.926[-5]	1.549
3	8.309[-8]	1.031	7.562[-3]	515.834
4	8.299[-6]	175.549	7.850[-3]	182.219
5	4.135[-7]	18.838	1.667[-3]	61.419
6	1.761[-6]	57.455	1.703[-4]	6.613

4 总结

本文详细研究了 Re³⁰⁺ 离子的 DR 过程。以基态作 为初态,考察了激发、辐射通道,CI 效应,DAC 效应 对 DR 速率系数的贡献。其中,4s 电子激发的贡献可 以忽略。4d 电子激发至7l 及更高壳层的贡献可以忽略, 中间双激发态辐射跃迁至8l 及更高壳层的贡献可以忽 略。在中高温度区域,CI 效应对单个能级的 DR 速率系 数有明显增大和减小的影响,但由于不同1'的增大和减小作用最终相互抵消,导致求和后的DR速率系数几乎没有影响,因此在总DR速率系数的计算中可以忽略CI效应。在温度kT_e < 20 eV区域,DAC效应对DR速率系数没有影响,在90 eV处DAC增大了总DR速率系数0.8%。之后随着温度的增高,影响逐渐增大。在280 eV处,增大总DR速率系数4.6%,在50000 eV处增大12.9%。由于级联退激中Auger退激速率较大,考虑高里德堡电子辐射跃迁而不考虑级联退激,在90 eV处对DR速率系数有1.6%的增大,并且随着温度的增大,影响逐渐增大,在50000 eV处增大到25.3%。对DR,RR,TBR速率系数做了比较,在全温度范围内DR都大于RR和TBR速率系数,相应的DR过程对于等离子体离化态分布和能级布居以及光谱模拟都极为重要。

参考文献:

- GILLERON F, POIRIER M, BLENSKI T, et al. J Appl Phys, 2003, 94: 2086.
- [2] SHEN Yunfeng, GAO Cheng, ZENG Jiaolong, et al. Journal of Atomic and Molecular Physics, 2007, 1000: 0364. (in Chinese)

(沈云峰,高城,曾交龙.原子与分子物理学报,2007,1000: 0364.)

- [3] ZHANG Guoding, FU Yanbiao, DONG Chenzhong, et al. Nuclear Physics Review, 2012, 29(2): 178.(in Chinese) (张国鼎, 符彦飙, 董晨钟, 等. 原子核物理评论, 2012, 29(2): 178.)
- [4] GU M F. Can J Phys, 2008, 86(5): 675.

- [5] LIANG Yaqiong, ZHANG Jiayong. Acta Astronomica Sinica, 2005, 46(2): 151. (in Chinese)
 (梁雅琼, 仲佳勇. 天文学报, 2005, 46(2): 151.)
- [6] ZENG G M, DAIDO H, TOGAWA T, et al. J Appl Phys, 1991, 69: 7460.
- [7] SULLIVAN G O, LI B W, ARCY R D. J Phys B At Mol Opt Phys, 2015, 48: 155025.
- [8] MARTINSON I. Reports on Progress in Physics, 1989, 52(2): 157.
- [9] YANG Zhihu, SU Hong, YIN Weiwei, et al. Nuclear Electronics and Detection Technology, 2004, 24(2): 155. (in Chinese) (杨治虎,苏弘, 殷玮玮,等. 核电子学与探测技术, 2004, 24(2): 155.)
- [10] MANDELBAUM P, KLAPISCH M, BAR-SHALOM A, et al. Phys Scr, 1983, 27: 39.
- [11] KILDIYAROVA R R. Phys Scr, 1996, **53**: 668.
- [12] WU T, HIGASHIGUCHI T, Li B W, et al. J Phys B At Mol Opt Phys, 2015, 48(6): 165005.
- [13] LI B W, SULLIVAN G O, FU Y B, et al. Phys Rev A, 2012, 85: 052706.
- [14] FU Yanbiao, WANG Xudong, SU Maogen, et al. Acta Phys.
 Sin, 2016, 65(3); 033401. (in Chinese)
 - (符彦飙, 王旭东, 苏茂根, 等. 物理学报, 2016, **65**(3): 033401.
- [15] FU Y B, DONG C Z, SU M G, et al. Phys Rev A, 2011, 83: 062708.
- [16] LI B W, SULLIVAN G O, FU Y B, et al. Phys Rev A, 2012, 85: 012712.
- [17] BALLANCE C P, LOCH S D, PINDZOLA M S. J Phys B At Mol Opt Phys, 2010, 43(20): 205201.
- [18] COLOMBANT D, TONON G F. J Appl Phys, 1973, 44: 3524.

Theoretical Studies of Dielectronic Recombination Rate Coefficients for Re³⁰⁺ Ions

TIAN Rui^{1,2}, FU Yanbiao^{1,2,†}, WEI Erlong^{1,2}, DONG Chenzhong^{1,2}

(1. College of Physics and Electronic Engineering, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China;
2. Key Laboratory of Atomic and Molecular Physics & Functional Materials of Gansu Province, Lanzhou 730070, China)

Abstract: Dielectronic recombination (DR) rate coefficients of complex ions are very important in some application research, such as extreme ultraviolet lithography and nuclear fusion. Based on the fully relativistic configuration interaction method, theoretical calculations are carried out to research the DR processes, in which Re^{30+} ions in the ground state $4p^{6}4d^{9}$ to $(4p^{6}4d^{9})^{-1}nln'l'(n=4\sim6, n'=4\sim23)$. Influence of excitation and radiation channels, configuration interaction, the effect of decays to autoionizing levels possibly followed by radiative cascades (DAC) are analyzed. The contributions through 4p subshell excitations to the total rate coefficient are $28.2\% \sim 44.9\%$ in the whole temperature region. Hence the contributions from inner-shell electron excitation are very important. The contributions from the DAC transitions increase smoothly with the increasing temperature and are about 12.9% at 50 000 eV. The contributions of DAC can not be neglected. By means of compared total DR rate coefficients to radiative recombination rate coefficients and three-body recombination rate coefficients, it shows that the maximum value of the radiation recombination rate coefficient is 22.6% of the DR rate coefficient and the maximum value of the three-body recombination rate coefficient is only 0.3% of the DR rate coefficient. The total DR rate coefficient is greater than either the radiative recombination or three-body recombination coefficients in the whole temperature range. The corresponding DR process is very important for plasma ionization distribution, population level and spectrum simulation. In addition to facilitate the application, the total DR rate coefficients for the ground state and the first excited state are fitted to an empirical formula. These results will provide the reference for the further analyses of rhenium laser plasma spectrum simulation and the complex structures ions DR process.

Key words: dielectronic recombination; DR rate coefficient; DAC effect

Received date: 28 Apr. 2018; Revised date: 25 May 2018

Foundation item: National Natural Science Foundation of China (11464043)

[†] Corresponding author: FU Yanbiao, Email: fuyb@nwnu.edu.cn.